

**101-030**

**NOVAS FERRAMENTAS AVANÇADAS PARA CARACTERIZAÇÃO DE MATERIAIS VIA XRF E XRD – ESTUDOS DE CASOS DE APLICAÇÕES E AVANÇOS TECNOLÓGICOS**

Bittar, D.(1);

BRUKER(1);

O desenvolvimento de novas ferramentas analíticas visando o aprimoramento de análises de Difração e Fluorescência de Raios X aplicadas à caracterização de materiais nas mais diversas áreas de conhecimento. Serão abordados assuntos como: troca automática de geometrias Bragg-Brentano para Feixe Paralelo (sem a intervenção física na troca dos componentes como fendas e Goebel Mirror), monocromatização do feixe primário, análises de Difração de Raios X em 2D, Pacotes analíticos para calibração prévia de Espectrômetros de Fluorescência de Raios X, entre outras inovações tecnológicas para melhoria dos resultados encontrados com as técnicas mencionadas.